

UNITECH

NOLIMITS

SERVIZIO	STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
microscopia confocale	microscopio A1/A1R (Nikon)
microscopia confocale FRET-FLIM	microscopio A1R (Nikon)
microscopia confocale SIM	microscopio A1 (Nikon)
microscopia confocale multifotone	microscopio A1 MP (Nikon)
microscopia widefield luce e fluorescenza	microscopio Vico (Nikon)
scansione automatica di vetrini	nanozoomer S60 (Hamamatsu)
microscopia elettronica a scansione - SEM	SEM Leo 1430, SEM Leo 438 VP (Zeiss)
preparazione campioni per SEM: doratura	Sputter Nanotech (Assing)
preparazione campioni per SEM: disidratazione	CPD - Critical Point Dryer (Baltec)
microscopia elettronica a trasmissione - TEM	EFTEM Leo 912ab (Zeiss), TEM SX100 (Jeol), TEM CM10 (Philips - ThermoFisher)
preparazione campioni per TEM: sezionamento	Crioultramicrotomo PowerTome XL (RMC)
micro-imaging RMN	RMN Advance 2200 (Bruker)
analisi di immagini	Arivis software
corsi di formazione per utilizzo delle diverse strumentazioni e tecniche fornite dalla piattaforma	